所建立的機率矩陣藉由統計指標量化填回該移動視窗的中心,即可形成紋理 影像,如圖 3-8 所示。

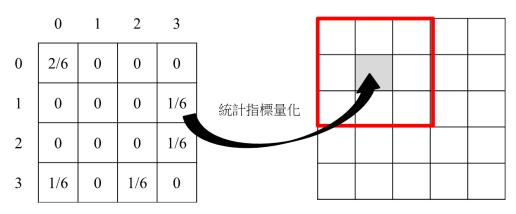


圖 3-8 統計指標量化產生紋理影像

由於前面的介紹為動態的移動視窗求取影像的局部灰階共生矩陣,其計算耗時且運算量較大,因此我們先將影像像素值映射到灰度級別 0~7 之間,即決定了灰階矩陣的大小固定為8×8,且設定移動視窗同為影像大小。在這樣的條件下直接計算整張影像的灰階共生矩陣,並統計量化使用公式(3.7)~(3.14)式求出八種特徵值。如圖 3-2(b)所示,本研究使用像素對的距離 d=1,每張影像中其像素對針對四種不同的相對方向分別統計,故共取得 32 種特徵值。

3.2.3 灰階連續長度矩陣(Gray Level Run-Length Matrix)之紋理特徵

灰階連續長度矩陣是在1974年由 Galloway [41]所提出的,其計算方式與灰階 共生矩陣類似。其目的在於統計影像中各個灰階值在不同的方向上連續出現的最 高次數,並定義了一些統計方法量化灰階連續長度矩陣中所包含的資訊。通常粗 糙的紋理中,會有較長的灰階值連續長度,而平滑的紋理,會有較短的灰階值連 續長度。於醫學影像處理上常結合此方法進行影像分類(Image classification)[39, 42]。

3.2.3.1 灰階連續長度矩陣的建立

二維的灰階連續長度矩陣建立流程如下:

(1) 假設有5×5大小的原始影像,其灰階範圍為2位元,灰階值介於0~3,如圖3-9。

1	3	2	1	3
2	3	0	1	0
0	0	0	2	1
2	2	1	1	1
0	2	3	1	1

圖 3-9 原始影像

(2) 建立空白的連續長度矩陣(Run-length matrix),令 L 為灰階值總數,R 為在給定的方向上灰階值能夠連續的最大長度值,則其大小為 $L\times R$ 。而常用的方向 θ 與共生矩陣同為 0° 、45°、90°和 135° 。本例中,水平角等於 0° 的連續矩陣大小為 4×5 ,如圖 3-10。

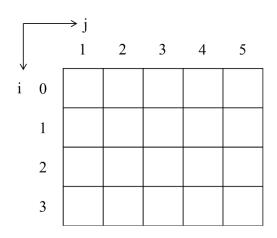


圖 3-10 $\theta = 0^{\circ}$ 之空白連續長度矩陣

(3) 統計灰階值在影像中連續長度分布的情況, p(i,j) 為連續長度矩陣第(i,j) 個元素的值,其中i代表灰階值,j代表連續長度,表示灰階值i在給定的方向上連續長度為j的次數,而本例中水平角等於0°所建立出的灰階連續長度矩陣如下圖3-11。

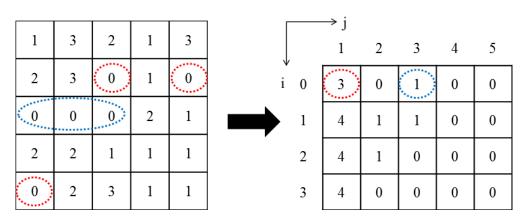


圖 3-11 建立 $\theta=0$ °之灰階連續長度矩陣

原始影像中對應空白灰階連續長度矩陣中位置i=0,j=3時,出現次數為1次。

3.2.3.2 統計指標量化

在建立出灰階連續長度矩陣後,使用不同的統計方法來計算出統計特徵,我們採用原始灰階連續長度矩陣文獻[41]所提出的統計特徵以及其他幾種常見的紋理特徵[43],分別為:

(1) Short Run Emphasis (SRE)

$$SRE = \frac{1}{n_r} \sum_{i=1}^{L} \sum_{j=1}^{R} \frac{p(i,j)}{j^2}$$
 (3.15)

其中n, 為連續長度的出現次數加總:

$$n_r = \sum_{i=1}^{L} \sum_{j=1}^{R} p(i,j)$$
 (3.16)

(2) Long Run Emphasis (LRE)

LRE =
$$\frac{1}{n_r} \sum_{i=1}^{L} \sum_{j=1}^{R} p(i, j) \cdot j^2$$
 (3.17)

(3) Gray-Level Nonuniformity (GLN)

GLN =
$$\frac{1}{n_r} \sum_{i=1}^{L} \left(\sum_{j=1}^{R} p(i, j) \right)^2$$
 (3.18)

(4) Run Length Nonuniformity (RLN)

$$RLN = \frac{1}{n_r} \sum_{j=1}^{R} \left(\sum_{i=1}^{L} p(i, j) \right)^2$$
 (3.19)

(5) Run Percentage(RP)

$$RP = \frac{n_r}{n_p} \tag{3.20}$$

其中 n_p 為像素點的數量, $n_p = L \times R$ 。

(6) Low Gray-Level Run Emphasis (LGRE)

LGRE =
$$\frac{1}{n_r} \sum_{i=1}^{L} \sum_{j=1}^{R} \frac{p(i,j)}{i^2}$$
 (3.21)

(7) High Gray-Level Run Emphasis (HGRE)

HGRE =
$$\frac{1}{n_r} \sum_{i=1}^{L} \sum_{j=1}^{R} p(i, j) \cdot i^2$$
 (3.22)

(8) Short Run Low Gray-Level Emphasis (SRLGE)

SRLGE =
$$\frac{1}{n_r} \sum_{i=1}^{L} \sum_{j=1}^{R} \frac{p(i,j)}{i^2 \cdot j^2}$$
 (3.23)

(9) Short Run High Gray-Level Emphasis (SRHGE)

SRHGE =
$$\frac{1}{n_r} \sum_{i=1}^{L} \sum_{j=1}^{R} \frac{p(i,j) \cdot i^2}{j^2}$$
 (3.24)

(10) Long Run Low Gray-Level Emphasis (LRLGE)

LRLGE =
$$\frac{1}{n_r} \sum_{i=1}^{L} \sum_{j=1}^{R} \frac{p(i,j) \cdot j^2}{i^2}$$
 (3.25)

(11) Long Run High Gray-Level Emphasis (LRHGE)

LRHGE =
$$\frac{1}{n_n} \sum_{i=1}^{L} \sum_{j=1}^{R} p(i, j) \cdot i^2 \cdot j^2$$
 (3.26)

如圖 3-2(c)所示,我們將影像像素值映射到灰度級別 0~7 之間後計算整張影像的灰階連續長度矩陣,並統計量化使用公式(3.15)~(3.26)式求出 11 種特徵值。本研究在每張影像中針對四種不同的相對方向分別統計,故共取得 44 種特徵值。

3.2.4 田村紋理特徵(Tamura Texture Feature)

田村紋理特徵是根據人類的視覺感知系統所計算出的紋理特徵,由田村等人在 1987 年提出[44],目前多應用於圖像檢索(Image retrieval)[45]。此種方法包含了六種特徵,本研究採用了其中三種與人類感知較有緊密關聯的特徵[45,46],分別為:

(1) 粗糙度(Coarseness, CRS)

粗糙度是田村紋理特徵中最基本的一個特徵,主要用於測量粗糙與細緻紋理的差異,其值越大表示紋理越粗糙,因此細緻的紋理的值會比粗糙紋理的小。其計算步驟如下:

步驟一: 計算大小為 $2^k \times 2^k$ 區域內所有像素點的平均強度值, $k \in (0,...,5)$,如(3.27) 式:

$$A_k(x,y) = \frac{1}{2^{2k}} \sum_{i=x-2^{k-1}}^{x+2^{k-1}-1} \sum_{j=y-2^{k-1}}^{y+2^{k-1}-1} I(i,j)$$
(3.27)

其中I(i,j)表示座標(i,j)的灰階值。

步驟二: 對於每個像素點 (x, y) ,分別計算水平(Horizontal)及垂直(Vertical)方向上不重疊區域之間的差值,如公式(3.28a)及(3.28b):

水平:
$$E_{k,h}(x,y) = |A_k(x+2^{k-1},y) - A_k(x-2^{k-1},y)|$$
 (3.28a)

垂直:
$$E_{k,y}(x,y) = |A_k(x,y+2^{k-1}) - A_k(x,y-2^{k-1})|$$
 (3.28b)

步驟三: 在每個像素點上,選出一個最佳大小,如(3.29)式:

$$S_{best}(x, y) = 2^K$$
 (3.29)

其中 K 為一個能令下式最大化的值:

$$E_{K}(x, y) = \max_{k} \left(E_{k,h}(x, y), E_{k,v}(x, y) \right), k = 0, 1, \dots, 5$$
(3.30)

步驟四: 計算圖像上 S_{host} 之平均值,即可計算出粗糙度,如(3.31)式:

$$F_{crs} = \frac{1}{M \times N} \sum_{i=1}^{M} \sum_{j=1}^{N} S_{best}(i, j)$$
 (3.31)

其中M為影像的長度,N為影像的寬度。

(2) 對比度(Contrast, CON)

對比度特徵反映出影像中灰階值強度的分布情況,其大小由以下四個因素決定:灰階動態範圍(Gray-level dynamic range)、直方圖(Histogram)中黑白兩部分兩極化的程度、邊緣的銳利度(Sharpness)以及重複模式的週期。其計算公式如下:

$$F_{con} = \frac{\sigma}{\left(\alpha_4\right)^n} \tag{3.32}$$

其中 σ 為灰階分布的標準差(Standard deviation),n為一正數, α_4 為平均值之四次矩(Forth moment)除以變異數的平方所得到的峰度(Kurtosis),如(3.33)式:

$$\alpha_4 = \frac{\mu_4}{\sigma^4} = \frac{\sum_{i=1}^{M} \sum_{j=1}^{N} (f(i,j) - \mu)^4}{M \times N \times \sigma^4}$$
(3.33)

其中 μ 為平均值。經過實驗,田村等人發現當(3.32)式之n=1/4時與人類的測量最接近一致。

(3) 方向性(Directionality, DIR)

方向性特徵包含了影像中的全域特性,用來描述紋理是如何沿著特定方向分 散或者集中。若兩張影像的差異只有在方向上,則此特徵值會相同。其計算步驟 如下: 步驟一: 計算每個像素點的梯度向量(Gradient vector)包括其大小 $|\Delta G|$ 及方向 θ ,如下所示:

$$\left|\Delta G\right| = \frac{\left|\Delta_H\right| + \left|\Delta_V\right|}{2} \tag{3.34}$$

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{\Delta_V}{\Delta_H} \right) + \frac{\pi}{2} \tag{3.35}$$

其中 Δ_H 及 Δ_V 分別為水平及垂直方向上的變化量,由影像分別與下列兩個 3×3 運算子作迴旋積運算後所得到。而所得到的 θ 為一個由逆時針方向測量的實數,因此水平方向為零。

水平:
$$\begin{vmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$
 (3.36a)

垂直:
$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{vmatrix}$$
 (3.36b)

步驟二: 建構邊緣機率直方圖(Edge probability histogram) H_D 來量化 θ ,並且計算所有 $|\Delta G|$ 大小超過閾值 t 的點如(3.37)式:

$$H_D(k) = \frac{N_{\theta}(k)}{\sum_{i=0}^{d-1} N_{\theta}(i)}, k = 0, 1, \dots, d-1$$
(3.37)

其中 $N_{\theta}(k)$ 為所有滿足 $(2k-1)\pi/2d \le \theta \le (2k+1)\pi/2d$ 及 $|\Delta G| \ge t$ 的點。利用閾值t來限定 $|\Delta G|$ 是為了防止去計算非邊緣點造成的不可靠方向。

步驟三: 最後,方向性可透過計算直方圖中峰值(Peak)的銳度(Sharpness)來獲得,如(3.38)式:

$$F_{dir} = 1 - r \times n_p \times \sum_{p}^{n_p} \sum_{\phi \in w_n} (\phi - \phi_p)^2 H_D(\phi)$$
(3.38)

其中 n_p 為峰的數量, ϕ_p 為在 H_D 中第p個峰的中心位置, w_p 為第p個峰的範圍,r為一正規化因子,與量化 ϕ 的程度有關,而 ϕ 為量化方向的規則(週期性的 180°取模)。

3.3 特徵選取

隨著影像技術的快速發展,影像中可以獲得的資訊也越來越多,即使是單色調的磁振影像,仍可利用許多影像處理的技術,從影像中取得許多特徵資訊。由 3.2 節所介紹的特徵擷取方法,所擷取的全部特徵資訊雖然可以對影像內容做更詳細的描述,但當計算的資料維度過大時,容易造成資料分析上的困難。而特徵選取便是一種能根據特徵資訊的重要性加以篩選的技術,於特徵集合中,刪除對分類辨識能力較低的特徵,僅保留有助於分類辨識的重要特徵子集合,以便更有效地和機器學習(Machine learning)與圖形辨識(Pattern recognition)結合[47,48]。此技術之目的在於縮減特徵資料維度,降低運算處理上的複雜度及時間,進而提升效率及辨識率。

本研究先使用 t 檢定[34,35]作為特徵選取法則,判斷各特徵變數能否明顯分辨掺有不同雜訊之磁振影像,並依照各特徵的分辨能力初步篩選出具有高鑑別度的特徵,作為候選特徵子集合。最後使用循序前進浮動選取法[36],從候選特徵子集合中挑選出最佳的特徵組合,以作為訓練類神經網路的輸入資料。

3.3.1 T 檢定

T檢定,亦稱學生 t 檢定(Student's t-test)[34,35],是一種以計算變數的平均值做為比較的方法,用於檢驗樣本的變數平均值差異程度,透過 t 分佈理論來推斷差異發生的概率,進而判定變數是否有顯著差異的特性。依比較的樣本數可分為單樣本 t 檢定(One sample t-test)和雙樣本 t 檢定(Two samples t-test),其中單樣本 t 檢定是用來比較一組樣本數據之平均值與一特定值有無差異,而雙樣本 t 檢定則是以